N31

究極の光ファイバ融着技術の実現に向けた高感度デブリ検出

~ガラスのCT画像で融着技術の天敵である微量ゴミ検出しレーザ融着技術の高度化を目指す~



Motivation どんな問題に取り組むのか?

Originality and Impact 新規性とインパクトは?

光ファイバの利用領域の拡大にともない、大 ロ径ファイバの融着接続時の従来のアーク放 電融着で生じる電極損耗補償不要な点や、 ボード上で集積布線された光ファイバへの余 長レス融着の可能性が高い点からレーザー 照射によるファイバ融着接続が注目されてい ます。しかしながら、レーザー照射によるファ イバ融着接続部の構造変化は未解明な部分 があり、基本物性評価が望まれます。

私たちは機械・電子部品等の内部構造を非破壊観測に 実績があるX線CT(Computed Tomography)技術による レーザー融着光ファイバの構造変化の観測研究に着手し、 産業用X線CTでは観測が困難なシリカ光ファイバ融着 部の構造変化を、SPring-8高輝度放射光マイクロCT (SP-µCT:SPring-8 micro-Computed Tomography) (図1) により観測に成功しました。これまで他手法では観測困難 であった融着部への内包デブリ観測ができ(図2)、本結果を もとにレーザー融着プロセス改善に生かすことができました。





NTT先端集積デバイス研究所

小池真司 (koike.s@lab.ntt.co.jp)